

RTTLIT S10 实时瞬态锁相热分析系统

RTTLIT Thermal Emission Microscopy System



产品介绍 Product Introduction

RTTLIT S10 实时瞬态锁相热分析系统基于非制冷红外探测器与Lock-In Thermography 锁相热成像技术，通过调制激励与算法增强，实现显微尺度下微弱热信号的高灵敏度捕捉与精准失效定位。系统锁相温度灵敏度可达 0.001°C ，最高显微分辨率可达 $5\mu\text{m}$ ，兼具高灵敏度、高效率与高性价比，适用于微弱发热点、隐性缺陷及复杂电路结构分析。广泛应用于PCB、PCBA、大尺寸主板、分立元器件、MLCC等电子产品的故障定位、失效检测等领域。



0.001°C
温度灵敏度



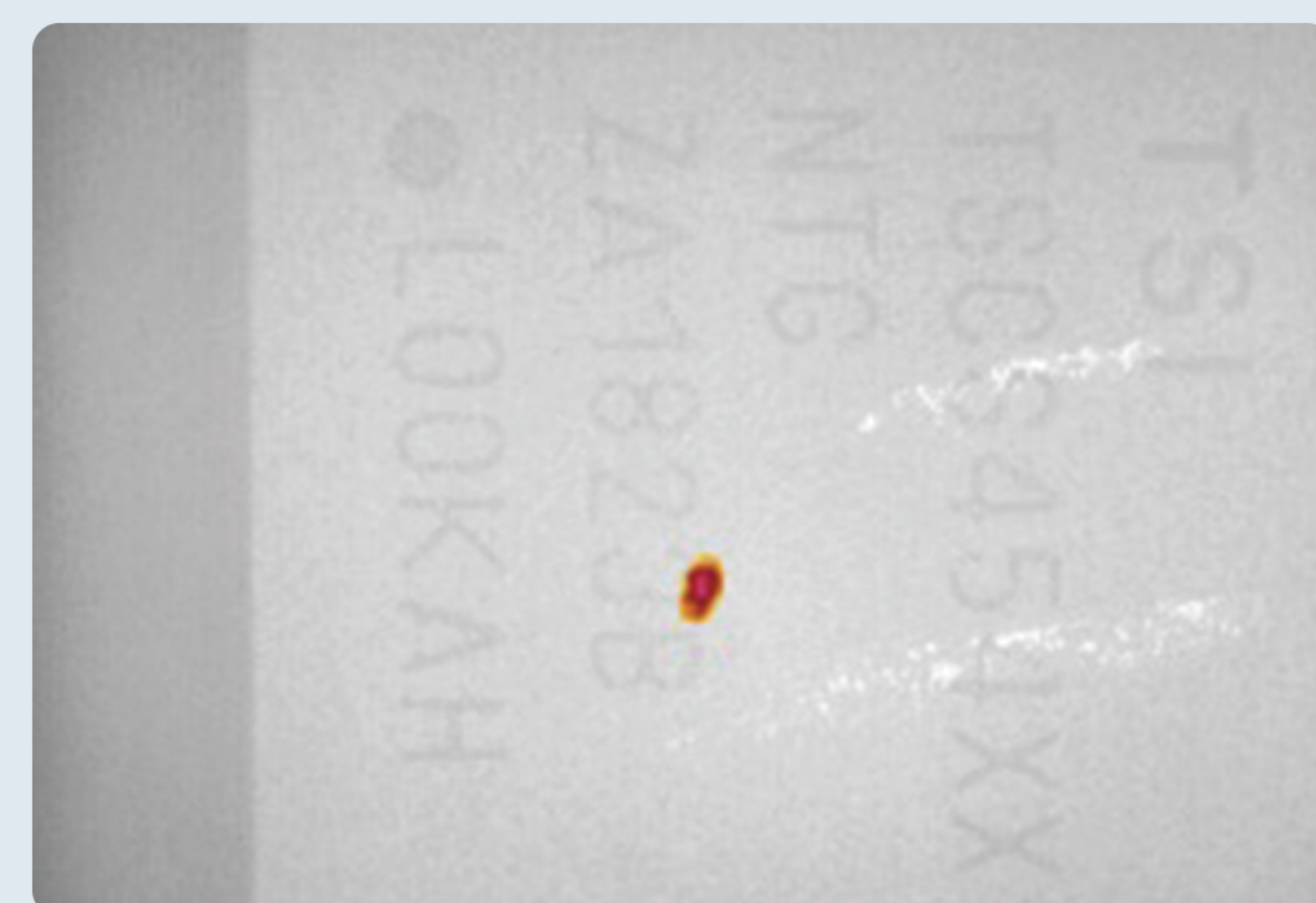
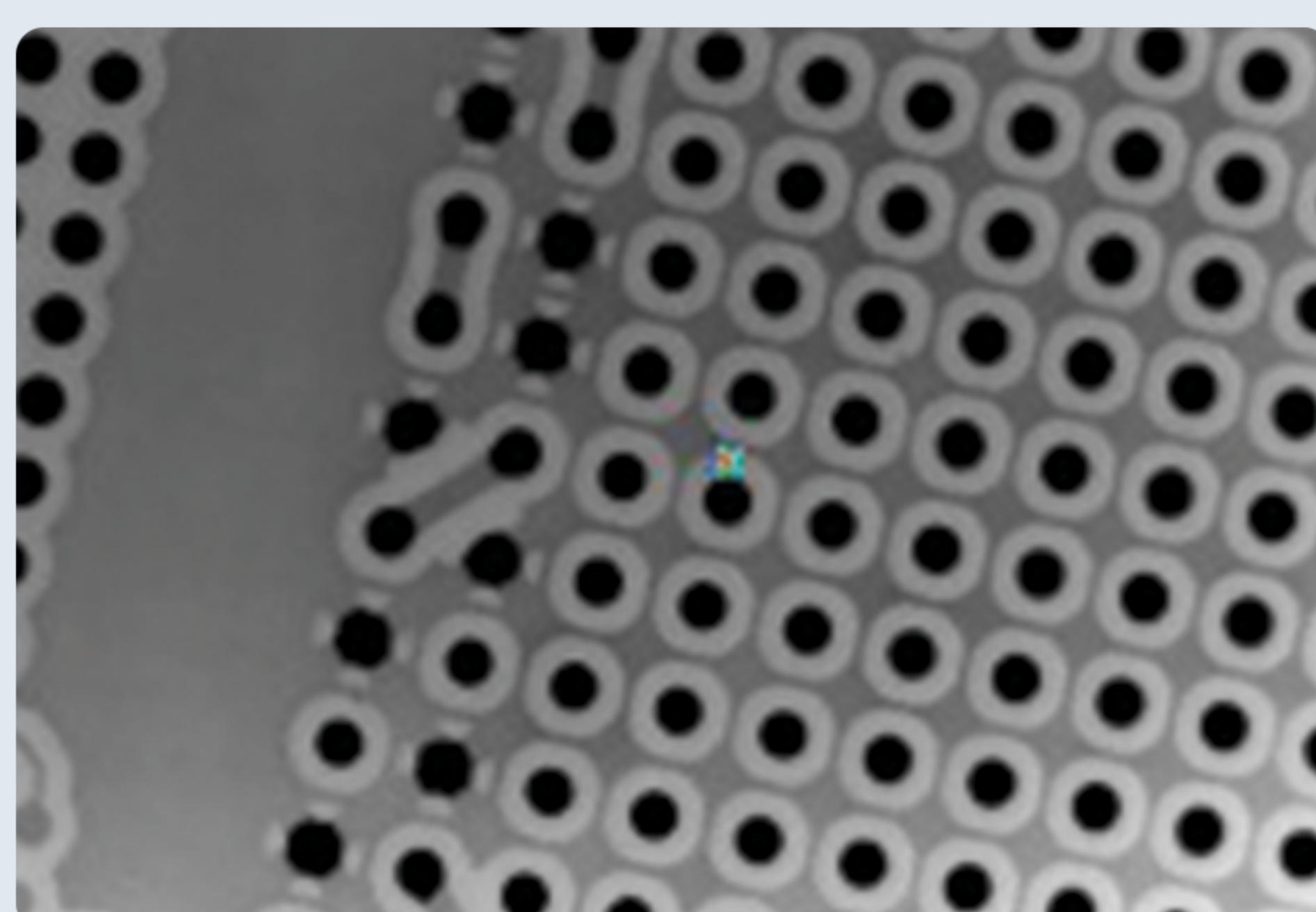
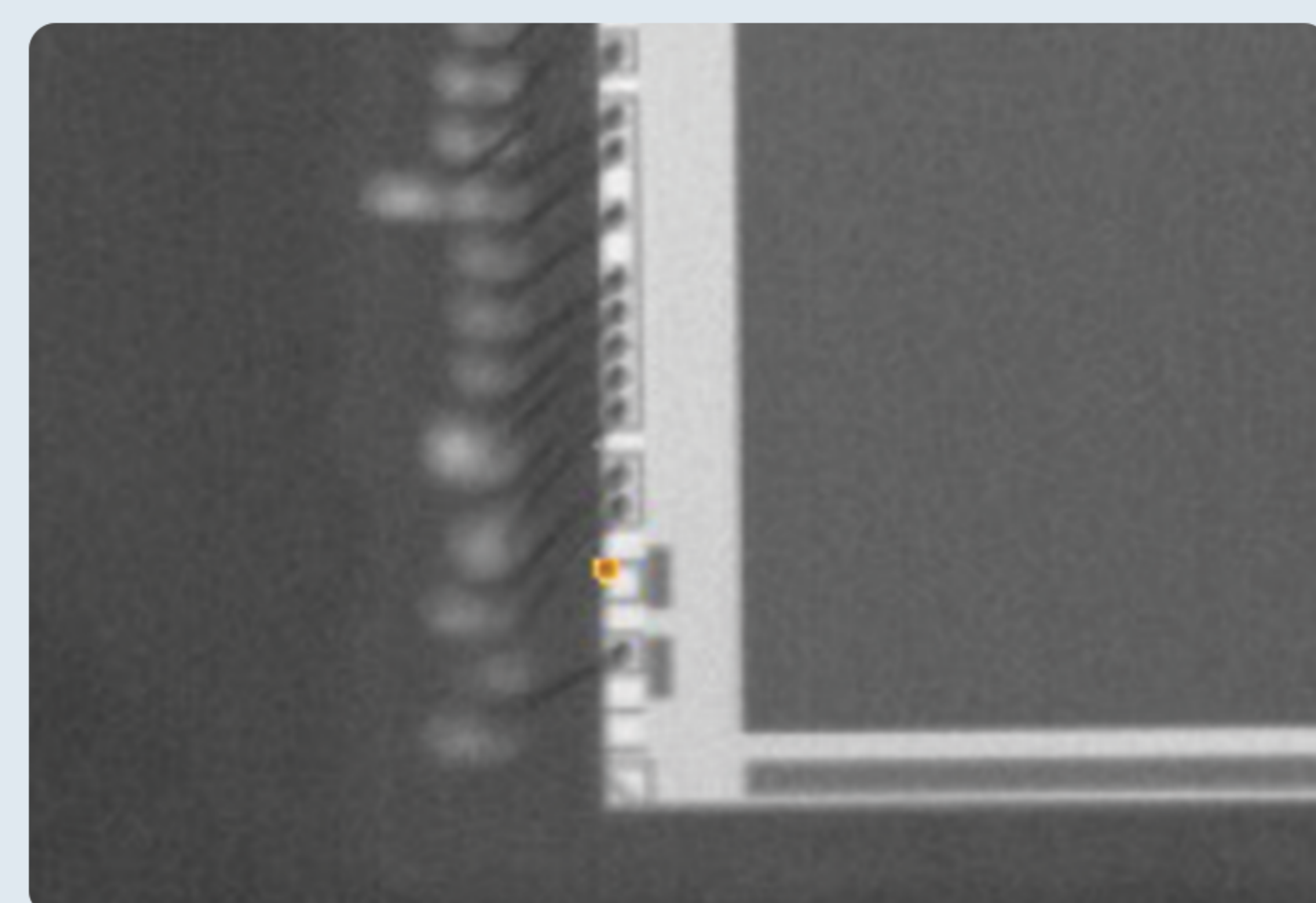
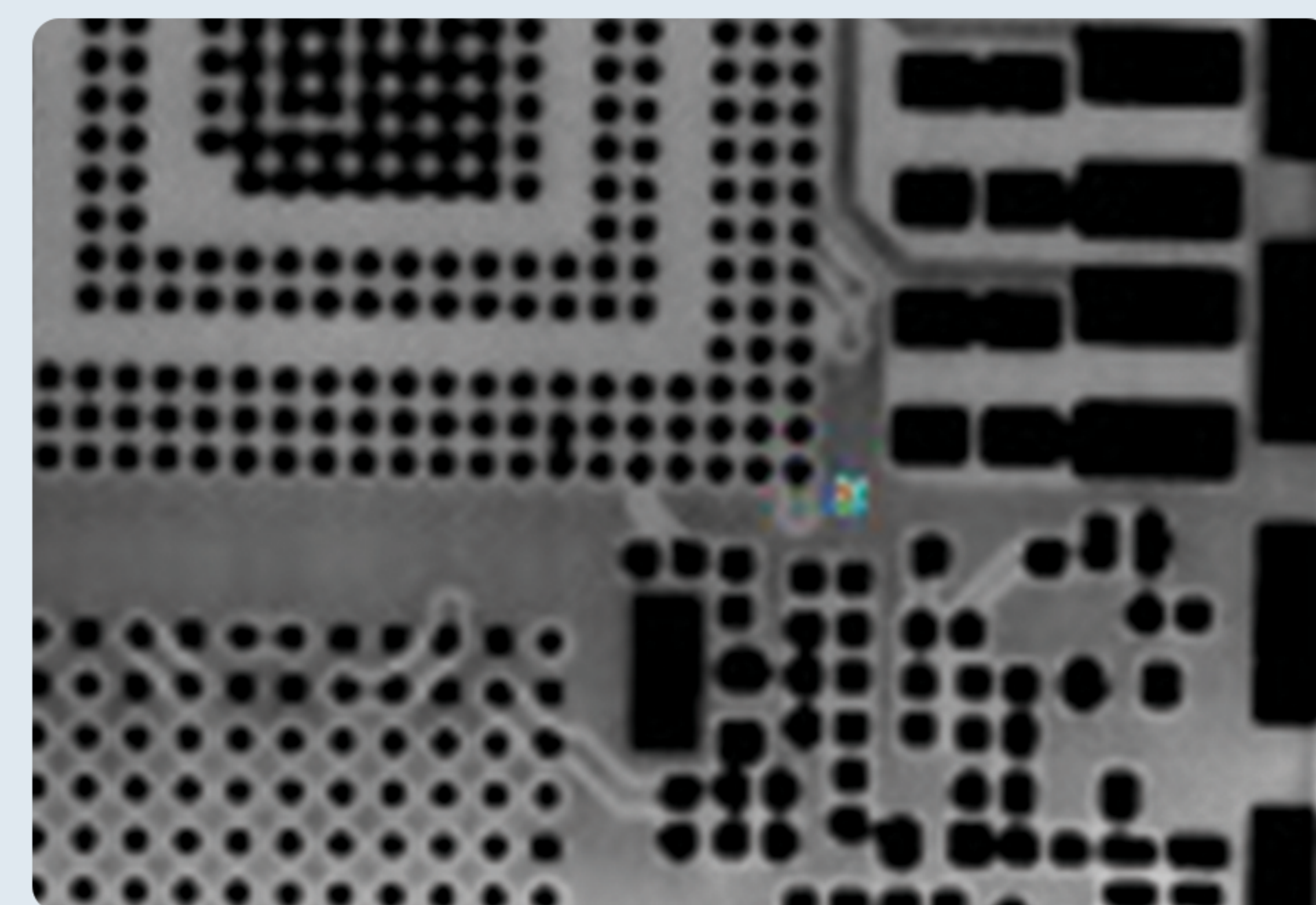
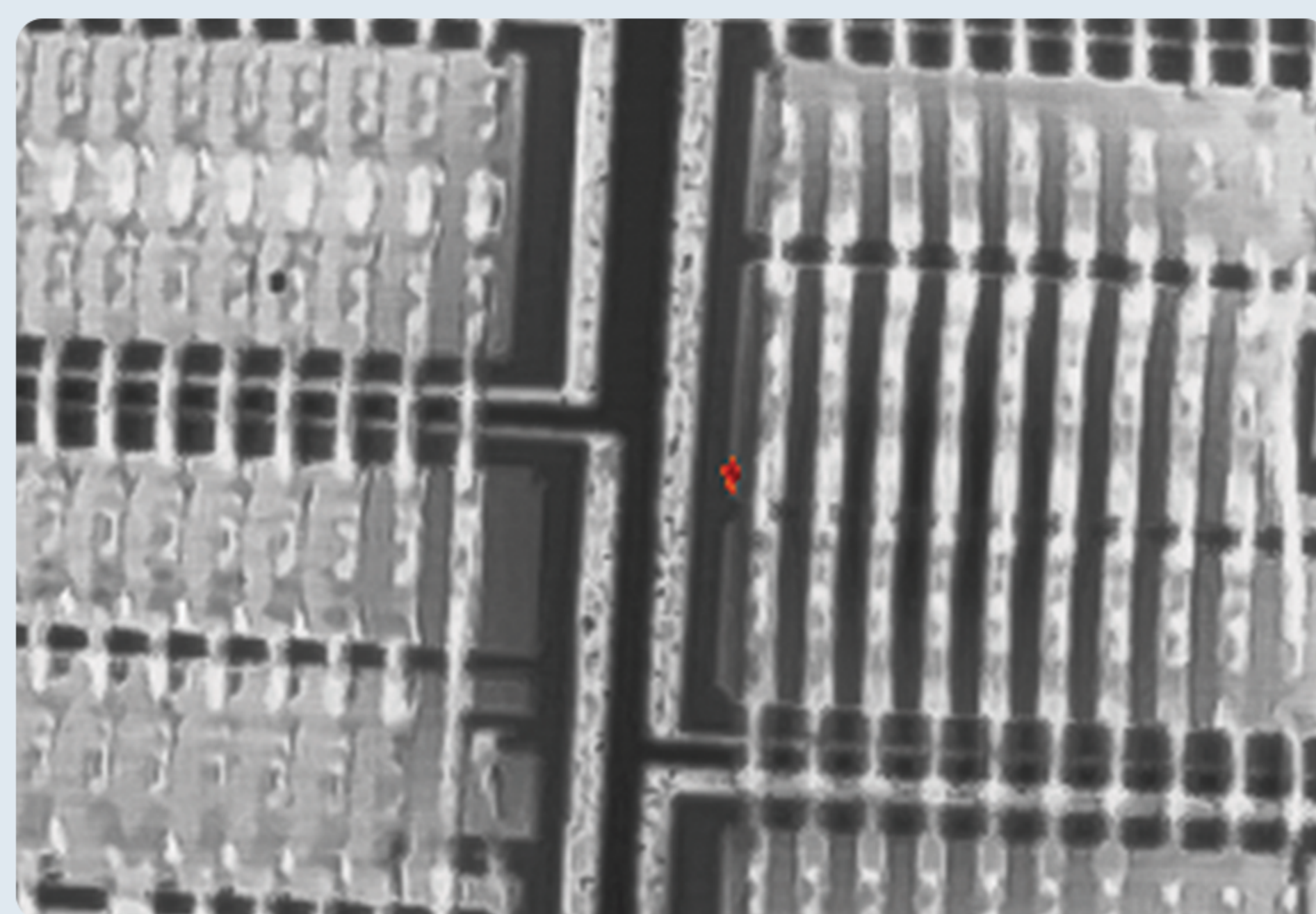
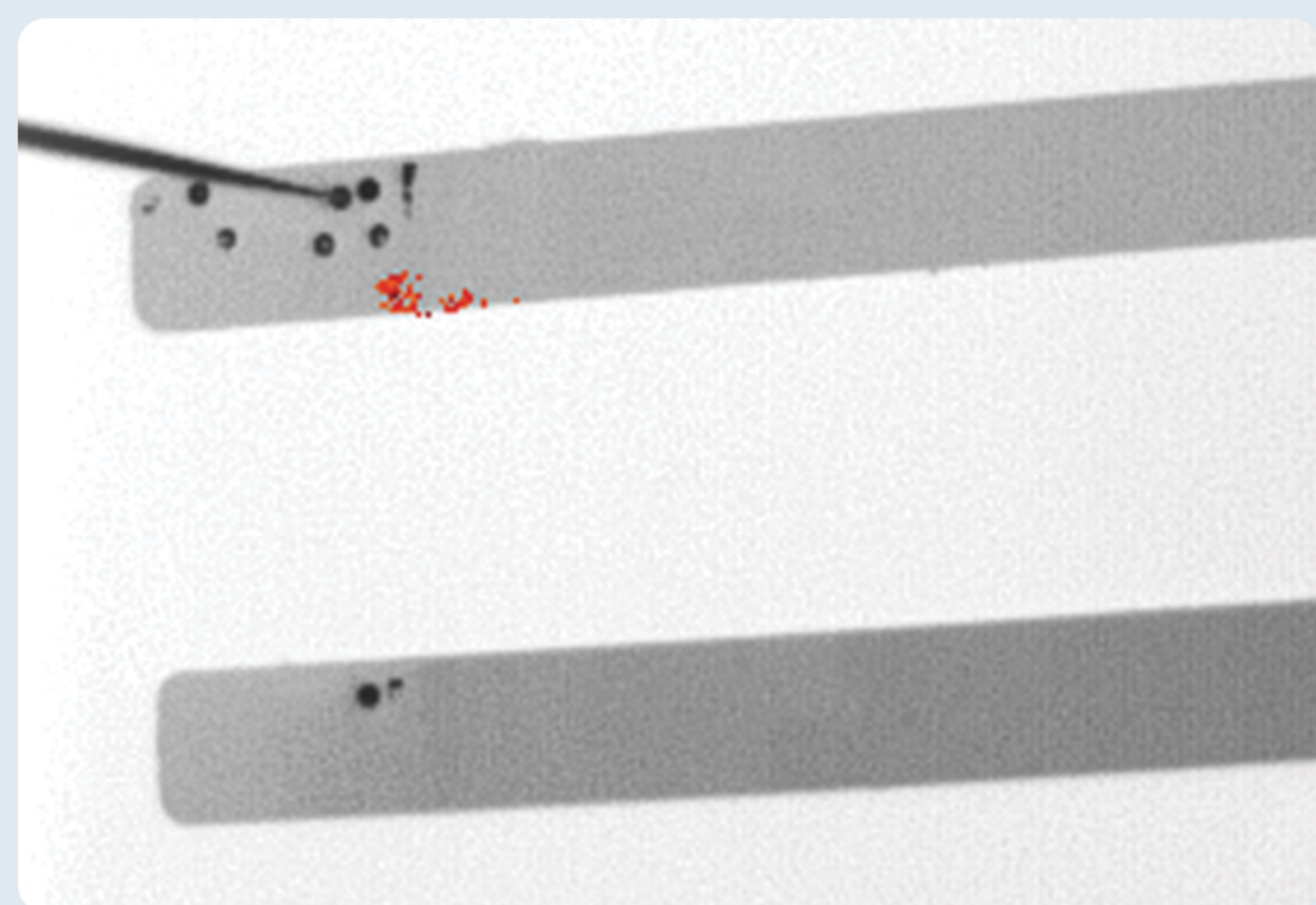
$5\mu\text{m}$
显微分辨率



40mK
NETD

案例展示

Case Presentation



设备参数

Device Parameters

型号 Model	RTTLIT S10		
品牌 Brand	致晟光电 ZanSun		
系统软件 System Software	实时瞬态锁相热分析系统 Real-Time Transient Lock-in Thermal Analysis System (RTTLIT)		
探测器 Detector	探测器类型 Detector Type	Vanadium Oxide (VOx)	
锁相测试 Lock-in Test	探测波长 Detection Wavelength	7-14 μm	
	制冷方式 Cooling Method	非制冷 Uncooled	
	帧频 Frame Rate	50 Hz	100 Hz
	分辨率 Resolution	640 x 512	
	NETD	45 mK	40 mK
	锁相灵敏度 Lock-in Sensitivity	1 mK	
	锁相频率 Lock-in Frequency	0.01 Hz - 12.5 Hz	0.01 Hz - 25 Hz
光学物镜 Optical Objective Lens		分辨率 Resolution	
Micro 广角镜头 Micro Wide-Angle Lens		N/A	
0.1X Lens		170 μm	
0.2X Lens		85 μm	
0.85X Lens		20 μm	
3X Lens		5 μm	